

分析報告書

試料名：

粃殻シリカ粉末 タイプ A

2025 年 12 月 23 日

地方独立行政法人 京都市産業技術研究所

荒川 裕也

○蛍光 X 線成分分析

測定条件

■機器名 : 蛍光 X 線分析装置 ZSX primus IV (株式会社リガク)

■分析方式 : FP 法

■試料調整 : 粉末バインダー固化法

■備考

- ・ C 成分は分析対象外 (試料調整に有機バインダーを使用しているため)。O 成分にも若干の影響があると考えられる。
- ・ 酸化物表示データは全て酸化物として換算しているが、実際には炭化物、硫化物系の化合物が存在する可能性も考えられる。

■測定結果詳細 : 別紙

○X 線回折測定（結晶化分析）

測定条件

■機器名 : X線回折装置 Ultima IV（株式会社リガク）

■分析方式 : 集中法

■試料調整 : 粉末法

■備考

- ・タイプ A については、非晶質に由来するハローが検出されたが、結晶性物質の存在を示すピークは確認できなかった（検出下限以下）。結晶ピークが確認できなかったため、結晶同定分析は実施せず。

■測定結果詳細 : 別紙

○粒度分布測定

測定条件

■機器名 : 粒度分布測定装置 LA-950V2 (株式会社堀場製作所)

■分析方式 : 湿式フローセル法 (水系)、超音波分散: 5 min

■備考

- ・メーカー推奨の分散剤 (ヘキサメタリン酸ナトリウム) 0.1%を分析用液媒 (イオン交換水) に添加。
- ・タイプ A、B とも比較的類似した粒度分布であるが、タイプ A の方が平均粒子径 (メジアン径) が若干小さく、細かい粒子が多いと考えられる。

■測定結果詳細 : 別紙